

# 被测试设备的监测单元ESU 04

## E.U.T. SUPERVISORY UNIT ESU 04

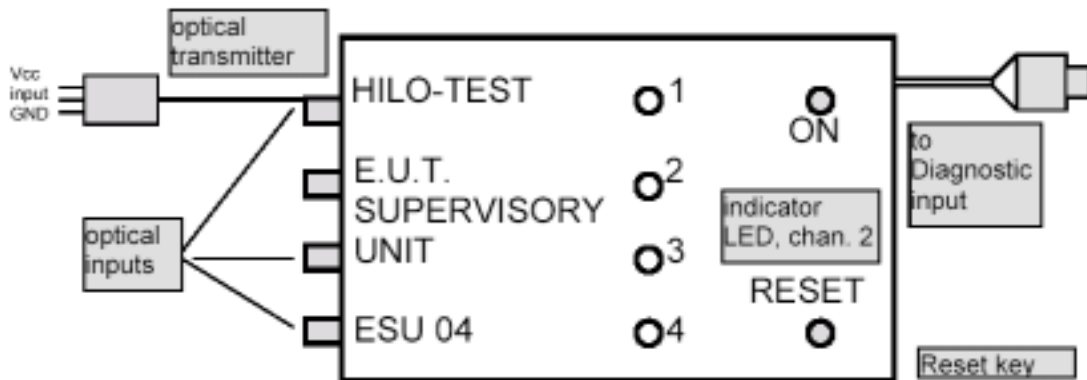
在电磁兼容测试过程中，被测设备的性能对EMC 测试结果至关重要。

为了发现待测设备的干扰原因，用高压探头进行测量是不适用的。测试设备和待测设备的连接将会降低待测设备的抗干扰能力。

被测试设备的监测单元，ESU 04 可以解决此问题。

待测设备的逻辑信息由传感器捕捉并通过光导被传送至待测设备的监测单元ESU 04。信息由触发器存储并传送至测试发生器的介电输入端。

通过光纤连接不会产生对待测设备的伏打电流连接。监测待测设备不会重新进行。连接 ESU 04 不会影响待测设备的抗干扰能力。



监测单元ESU 04有4个独立的光纤输入。当接收到一光脉冲时，触发器被触发，信息被存储。发光二极管（LEDs）指示触发器的逻辑状态触发器的输出与发生器的介电输入相连。每次测试程序完成后，发生器的介电输入均被显示，其结果显示在测试协议上。显示完毕后，触发器被重新设置。

捕捉待测设备的逻辑信息由配有光发送器输出的传感器完成。不同的逻辑单元：CMOS, HC AC, TTL 等可用于监测低、高信号。传感器直接与待测电路相连。二者均由同一电源进行供电。

同时还有可能将用户选定的传感器连接至监测单元 ESU 04。